

مجله پژوهش فیزیک ایران، جلد ۱۰، شماره ۴، زمستان ۸۹

/

ardyanian@du.ac.ir :

(دریافت مقاله: ۱۳۸۹/۷/۴ ؛ دریافت نسخه نهایی: ۱۳۸۹/۹/۳۰)

۱۰۰°C	SiO	GeO	(1 < x < 2) GeO _x / SiO _y
(TEM)	(FTIR)		(XPS)
۹۰۰°C	GeO _x		
	eV	۴۰۰°C	
		GeO _x	
(FWHM)			SiO
			GeO _x

:

مقاله کامل در جلد انگلیسی مجله با همین شماره به چاپ رسیده است.